



(11) **EP 2 233 913 A1**

(12) **EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG**

(43) Veröffentlichungstag:
29.09.2010 Patentblatt 2010/39

(51) Int Cl.:
G01N 21/27 (2006.01) **G01N 21/64** (2006.01)

(21) Anmeldenummer: 09156073.0

(22) Anmeldetag: 24.03.2009

(84) Benannte Vertragsstaaten:
AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO SE SI SK TR
Benannte Erstreckungsstaaten:
AL BA RS

(72) Erfinder:
• **Resch-Genger, Dr. Ute**
12203, Berlin (DE)
• **Hoffmann, Dr. Katrin**
12524, Berlin (DE)
• **Behnke, Thomas**
13349, Berlin (DE)
• **Würth, Christian**
10245, Berlin (DE)

(71) Anmelder: **BAM Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung**
12205 Berlin (DE)

(74) Vertreter: **Zimmermann & Partner**
Josephspitalstrasse 15
80331 München (DE)

(54) **Optischer Standard zur Kalibrierung und Charakterisierung von optischen Messeinrichtungen**

(57) Die Erfindung betrifft einen optischen Standard (10) zur Kalibrierung oder Charakterisierung von optischen Messeinrichtungen und als Bezugssystem für Intensitäten bzw. Intensitätsmessungen. Der erfindungsgemäße sandwich-artig aufgebaute Standard (10) umfasst eine Kombination von mindestens zwei im Wesentlichen planparallel miteinander verbindbaren oder verbundenen schichtförmigen optischen Standardmodulen

(12) mit definierten optischen Eigenschaften, wobei die Standardmodule (12) sich jeweils durch mindestens eine optische Eigenschaft voneinander unterscheiden, nämlich durch ihre Absorptions-, Emissions-, Streu- und/oder Reflexionseigenschaften, und die Standardmodule (12) so beschaffen sind, dass sie mit einer auf einer ihrer beiden Hauptflächen (12.1) auftreffenden elektromagnetischen Strahlung in physikalische Wechselwirkung treten.

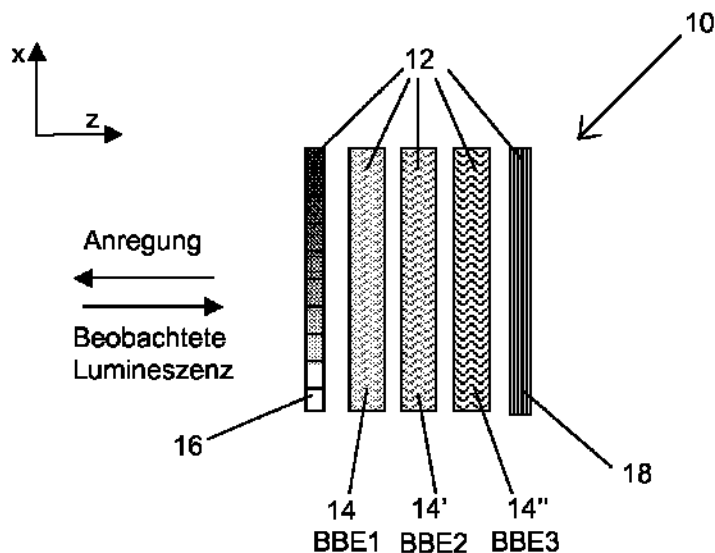


FIG. 3

EP 2 233 913 A1